**PLAN DE CALIDAD**

**ITERACIÓN 1 TSP**

**STATUS QUO**

**ZAMIR ANDREI GARCÍA ROMERO**

**ÁLVARO DAVID LÓPEZ PINILLA**

**DIEGO ANDRÉS LOZANO ROLDÁN**

**WILMAN RINCON BAUTISTA**

**DEIVIS ENRIQUE VERGEL ARENAS**

**CONCEPTOS AVANZADOS DE INGENIERÍA DE SOFTWARE**

**UNIVERSIDAD DE LOS ANDES**

**2.015**

# Métricas

• Tasas de resumen:

LOC /hora,

% de LOC reuso de proyectos previos,

% de LOC nueva para reuso.

• Porcentaje libre de defectos:

se calcula para cada fase y es el % de componentes que está libre de defectos en esa fase.

• Defectos por página: promedio de defectos removidos por página de los documentos de diseño de alto nivel y de requerimientos.

• Defectos por KLOC: Un defecto es cualquier elemento de requerimientos, de diseño, o implementación, que si no es cambiado puede causar el mal uso, diseño, implementación, pruebas o mantenimiento del producto. (Ver tabla 5.8 en el libro para un estándar inicial).

• Tasas de defectos: provee información sobre la calidad de las revisiones de código y diseño. Por ejemplo, para (errores encontrados en revisión de diseño / errores encontrados en pruebas) se considera que 2.0 es un resultado que muestra una buena estrategia de revisión.

• A/FR (Appraisal to failure ratio): es el razón del tiempo gastado en actividades de revisión e inspección / por el tiempo pasado en las actividades de pruebas.

• Tasas de revisión e inspecciones: Mide la velocidad de revisión de documentos, de discos y de código.

• Tasa de inyección de defectos: (Defectos /Hora)

• Tasa de remoción de defectos: (Defectos /Hora)

# Yield de fase

Porcentaje de defectos removidos en una fase dada respecto los defectos totales del programa.

# Yield de proceso

El Yield de proceso, mide le Yield del proceso hasta antes de una fase dada.